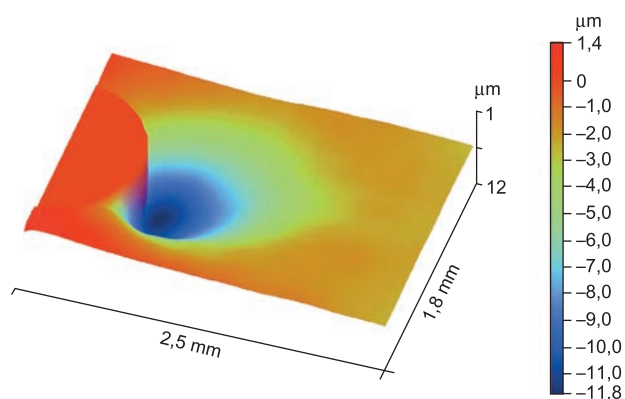
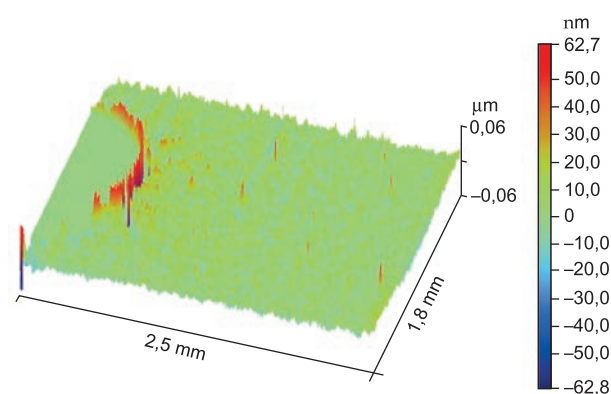


ОПТИЧНИЙ 3D-ПРОФІЛОМЕТР



Відтворена хвилястість поверхні



Відтворена шорсткість поверхні

Призначення

Відтворення рельєфу поверхні і визначення параметрів шорсткості та хвилястості

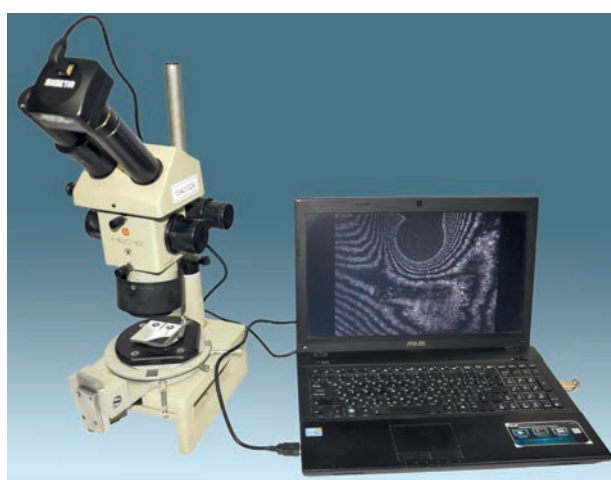
Характеристики

Оптичний 3D-профілометр створений на базі бінокулярного мікроскопа. Поеднує в одній конструкції мікроскоп, інтерферометричну насадку, цифрову відеокамеру та генератор пилкоподібної напруги. Містить програмне забезпечення для оброблення інтерферограм поверхні, керування фазозсувним елементом та синхронізації роботи приладу. Досліджуваний зразок закріплюють на двокоординатному столику мікроскопа.

Поле зору, мм	3–34
Вимірювана шорсткість Ra, мкм	
з одним лазером	0,01–0,12
з двома лазерами	0,2–6,0
Вимірювана хвилястість, мкм	0,1–40
Час вимірювання та отримання результатів, с	≤1
Вага, кг	
мікроскопа	~8
прилада з мікроскопом	≤9

Охорона інтелектуальної власності

IPR2



Зовнішній вигляд 3D-профілометра

Переваги

Безконтактний спосіб отримання інтерферограм поверхні. Висока швидкодія. Швидка зміна розмірів ділянки спостереження. Низька собівартість виготовлення

Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL7, TRL4
На замовлення здійснюється виготовлення з подальшим обслуговуванням та навчанням персоналу

Контактна інформація

Корній Валентина Василівна, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, +38 032 263 70 49, e-mail: valia.korniy@gmail.com